



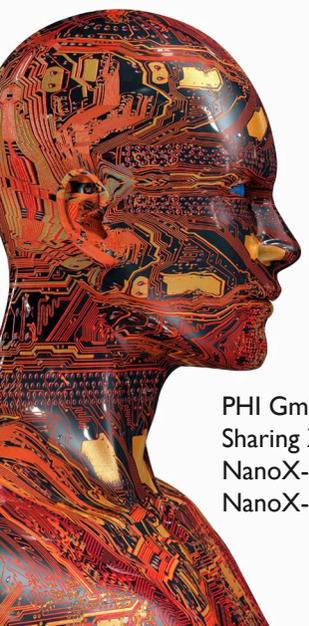
PHYSICAL ELECTRONICS GMBH

NanoX-Pert Advanced Materials

Im Fokus:
Kolloid und Grenzflächenforschung

Interdisziplinäre Technologien für die komplexen
und zukunftsweisenden Forschungs- und
Entwicklungsfelder der Materialwissenschaften
und Werkstoffkunde

Leitung: Stefan Reichlmaier
Termin: 18.04.2018
Ort: Ismaning, Fraunhoferstr. 4
Physical Electronics GmbH



PHI GmbH's INHOUSE Seminare 2018/2019:
Sharing X-Perience mit NanoX-Pert
NanoX-Pert LifeScience (17. Oktober 2018)
NanoX-Pert AdvancedMaterials (April 2019)

Registrierung:

bis 29.03.2018

- Ich melde mich für das Seminar an
 Ich kann leider nicht teilnehmen, bitte
senden Sie mir Informationen über
alternative Termine zu.

Name

Firma/Institut

Abteilung/Position

Straße/Postfach

Land/PLZ/Ort

Tel./Fax

E-Mail

Die Datenschutzerklärung (www.phi-gmbh.eu/imprint)
habe ich zur Kenntnis genommen:

Ort, Datum Unterschrift

Die Agenda des Tages:

- 09:00 Registrierung
09:15 Begrüßung und Einleitung
09:30 **Anwendungsbeispiele:
Warum High End Analysis?**
10:15 Vorstellung der Methode ToF-SIMS
Vorstellung der Methode XPS
Vorstellung der Methode Auger
11:15 Kaffeepause
11:40 **Dr. Miriam Unger (Anasys Instruments)
Vorstellung AFM-IR +IR Microscope
mit 0,5µm Ortsauflösung**
12:15 Mittagessen (Buffet)
13:00 **Praktischer Teil (4 Gruppen á 20 min)
ToF-SIMS; XPS; Auger & AFM-IR**
14:30 **Herr Weingärtner (KIT Karlsruhe)
Anwendungsbeispiele mit
Auger Spektroskopie**
15:00 **Neueste innovative Technologien &
Entwicklungen im Bereich
Oberflächenanalytik**
15:30 Zusammenfassung:
Testmessungsgutschein & Feedback
15:45 Kaffeepause
16:00 Möglichkeit zur Diskussion Ihrer
individuellen Fragestellung
16:30 Ende des Seminars

Zielsetzung:

Dieses Seminar vermittelt Ihnen durch eine interdisziplinäre Herangehensweise einen Überblick über die wichtigsten nanoanalytischen Methoden und gibt Ihnen einen ersten Eindruck.

Wie bewerten Sie als Experte das Alterungsverhalten von Beschichtungen? Haben Optimierungen und Maßnahmen funktioniert?

Das Seminar stellt Ihnen analytische Nachweisverfahren für die Erforschung von Nanoschichten oder z.B. zur Qualitätskontrolle, vor.

Für die Detektion organischer Substanzen auf Oberflächen mit höchster Empfindlichkeit ist TOF-SIMS die etablierte Analysenmethode.

Freuen Sie sich auf die Vorstellung der neuesten Geräteentwicklungen, in der Oberflächenanalytik!

Unser Seminar, genau das Richtige für Sie

Kontaktinformationen:

Anmeldung zum kostenlosen Seminar inklusive Testmessungs-Gutschein für Neukunden, Verpflegung während des Seminars sowie Unterlagen zum Themengebiet.

Ihre Anmeldung richten Sie bitte per E-Mail, auf dem Postweg bzw. per Telefon oder Fax an:

Physical Electronics GmbH
z. Hd. Stefanie Zauzig
Fraunhoferstraße 4
D-85737 Ismaning
TEL. +49/89/96 275-0
FAX +49/89/96 275-50
Email szauzig@phi-europe.com
URL www.phi-gmbh.eu

Auch bei sonstigen Fragen zum Seminar steht Ihnen Frau Zauzig gerne zur Verfügung.

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt, darum bitten wir Sie, sich rechtzeitig anzumelden.

Sie können leider nicht teilnehmen?
Gerne senden wir Ihnen Informationsmaterial über alternative Termine zu.

